

## ■ 用途 Application

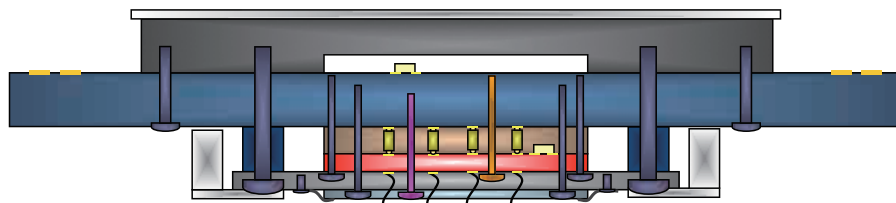
カンチレバー型プローブカードによるペリフェラル配置形状の同時多数個測定では機構によるDUT制約があります。VTシリーズは垂直型機構を採用することでDUTの制約を解消し、電気特性も向上できます。VTシリーズはペリフェラル(周辺配置)パッド配列の同時多数個測定に最適なプローブカードです。

## ■ 特長 Feature

1. 小さな針跡痕
2. 柔軟なマルチレイアウト
3. 狭ピッチ対応
4. 広範囲(低温から高温)の測定
5. アルミパッドへの安定した接触性
6. 1ピン交換が可能

## 基本仕様 Specifications

パッドピッチ Pad Pitch	千鳥(Staggered)25 $\mu$ m 単列(In-line)50 $\mu$ m	推奨OD時の針圧 Probe force	2.0gf@OD=70 $\mu$ m
パッドサイズ Pad size	□33 $\mu$ m	最大OD Max OD	100 $\mu$ m
針立て領域 Max Probe Area	□60 $\mu$ m	基板下面～針先 Probe Depth	12.0mm $\pm$ 0.3mm
針位置精度 Alignment	$\pm$ 5 $\mu$ m	最大電流 Max Current	200mA
高さバラツキ Planarity	20 $\mu$ m以内	使用温度 Temperature range	-40 $^{\circ}$ C~175 $^{\circ}$ C
		最大ピン数 Max Pin	10,000



※VT断面図

*Your Probing Partner*



JAPAN ELECTRONIC MATERIALS CORPORATION  
日本電子材料株式会社

<http://www.jem-net.co.jp/>